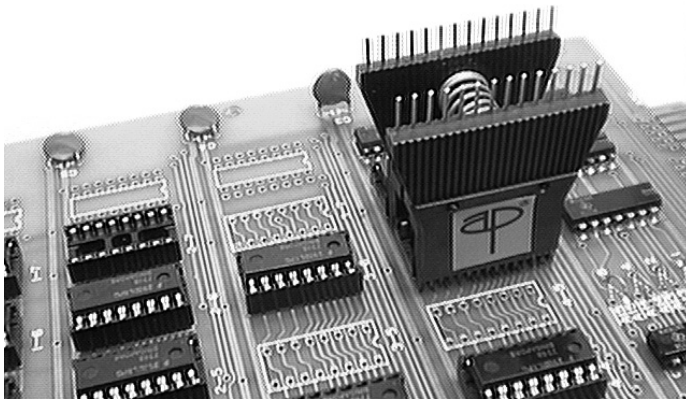
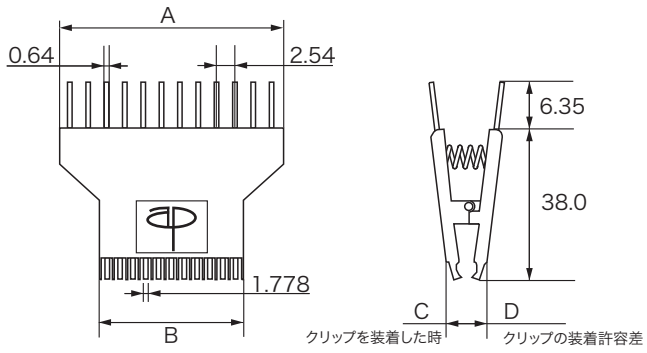
シュリンク・ピッチ DIP ICテストクリップ

AP

（寸法単位：mm）





A,B,C,D寸法は下表を参照

1.778mmピッチ用静電防止材使用

●1.778mmピッチDIP ICテストクリップが標準の2.54mmピッチDIP ICテストクリップに加えて遂に登場

6機種 -10.16mm（0.4"）ピッチ（28ピン用）
-15.24mm（0.6"）ピッチ（28,42,52,64ピン用）
-19.05mm（0.75"）ピッチ（64ピン用）

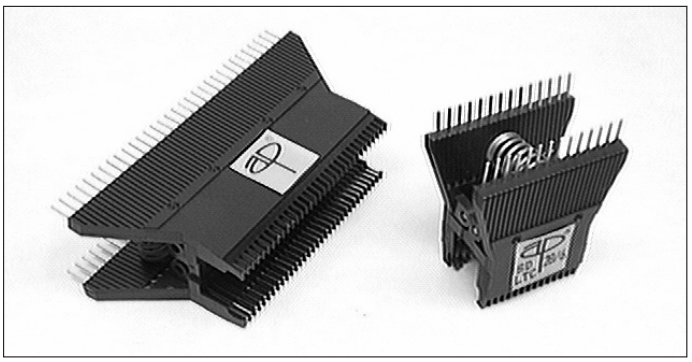
●高密度のPC基板でも使用しやすいように幅の狭いくわえ口

●本テストクリップの上部コンタクトは2.54mmピッチですから標準のコネクタにも簡単に接続できます。
下部のコンタクトは1.778mmピッチ

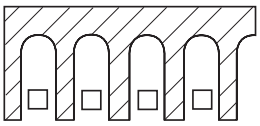
●完全な押さえ付け
強力な高品質の金属スプリングで検査中のDIPをがっちりと押さえますから、プローブの重さでテストリードとの接続が離れることはありません。

●高信頼性
抜群の信頼性を誇るコンタクトへのこすり付け方式ですから、正方形のコンタクトは狭い幅のDIPリードから滑り落ちることはありません。

●テストの安全性を重視
ピンのショートの危険性を回避するためDIP間にコンタクトが櫛状に挿入されているのでショートの心配はありません。



コンタクトを上部から見た図



仕様
ボディ：ガラス繊維入り（30%）静電防止プラスチック材（UL94V-0）、黒色
コンタクト材：合金（CuNi18Zn20）メッキ無し
温度範囲：-55℃～+165℃　相対湿度：80%以下
最大電流：2A　最大電圧：250V　テスト電圧：コンタクトとコンタクト間=1000V　テスト電圧：コンタクトとアース間=1500V

型　番	ピン数	適合デバイス幅	A寸法（mm）	B寸法（mm）	C寸法（mm）	D寸法（mm）
SD-LTC28/4	28	10.16mm / 400mil	36.37	25.27	16.25	17.00
SD-LTC28/6	28	15.24mm / 600mil	36.37	25.27	19.30	20.57
SD-LTC42/6	42	15.24mm / 600mil	54.15	37.72	19.30	20.57
SD-LTC52/6	52	15.24mm / 600mil	66.85	46.61	19.30	20.57
SD-LTC64/6	64	15.24mm / 600mil	82.10	57.28	19.30	20.57
SD-LTC64/7	64	19.05mm / 750mil	82.10	57.28	24.13	25.40